

國立勤益科技大學前瞻電資科技研究所修業要點

108年9月3日108學年度第1學期第2次課程及學位學程會議通過
109年5月14日108學年度第2學期第1次課程及學位學程會議通過
110年10月12日110學年度第1學期第1次所務會議通過
111年11月23日111學年度第1學期第1次所務會議通過

- 一、本要點依據本校學則、「博士學位候選人資格考核辦法」及「博士學位考試辦法」訂定。
- 二、畢業最低條件如下：
 1. 畢業至少應修滿36學分【共同必修18學分（產業實務研發論文12學分，實務專題研究4學分、暑期產業實習2學分及全學年產業實務實習0學分），選修至少18學分】，並通過學術研究倫理課程。
 2. 修習實務專題研究2年。
 3. 第一學年與第二學年度暑期產業實習2年。
 4. 第三學年與第四學年全學年產業實務實習2年。
 5. 外籍生不參與產博計畫，另擇選修科目折抵實習2學分。
 6. 就學期間在SCI/SCIE/SSCI國際期刊至少發表（含接受）論文一篇，掛名作者至多四人，除指導教授外須掛名第一作者。
 7. 除第6點之外，至少完成下列任一項成果：
 - (1) 在SCI/SCIE/SSCI或ESCI/EI國際期刊發表論文一篇，相關條件同第6點。
 - (2) 與研究有關之發明專利一件。
 8. 英文門檻：（三擇一）
 - (1) IBT-TOELF61分以上、TOEIC650分以上或IELTS4分以上。
 - (2) 全民英檢中級檢定通過。
 - (3) 出席國際學術研討會並以英語口頭發表論文，國際學術研討會的會議贊助者需為IEEE、IET、ACM，或會議論文被Ei Compendex、Engineering Village、Scopus資料庫收錄。
- 三、資格考試之相關規定
 1. 資格考試方式：以下二擇一，以口頭報告方式評分。
 - (1) 提出與研究領域相關的學術研究計畫。
 - (2) 提出與研究領域相關的發明專利技術分析。
 2. 資格考試時間：

本所研究生須參加資格考試，欲參加之考生須於資格考試前二周提出申請，第一次未通過者，得以再申請重考一次，但每位研究生至多申請2次資格考試。研究生於三年級結束前（不含休學，休學期間不得參加資格考試）必須通過資格考試。
 3. 資格考試委員會組成：

資格考試委員會委員由指導教授推薦並經所長核定後聘任。
資格考試委員會置委員五人，指導教授為當然委員，其他四位委員由指導教授依專長領域推薦校內專任助理教授（含）以上教師擔任，必要時得推薦校外專家學者。委員會召集人由指導教授以外的四位委員互推擔任之。
- 四、博士學位候選人資格之相關規定

研究生於修滿第二條第一款所規定之實務專題研究4學分，選修至少18學分並通過資格考試後，始得提出博士學位候選人資格審定之申請，經指導教授簽名同意，送所務會議審查通過，方能取得博士學位候選人資格。
- 五、博士學位考試之相關規定

產業博士學位學程研究生於獲得博士學位候選人資格後，研究成果達到規定者，提送學位論文應填具學位考試申請表外，檢附歷年成績單、論文初稿含摘要並完成「論文原創性比對」且相似度 $\leq 20\%$ ，若相似度超過20%則檢附說明經指導教授書面同意後，始得提出學位考試之申請。經所務

會議資格審查審定合格，及通過口試委員名單後，始得安排學位考試。學位考試依據國立勤益科技大學博士學位考試辦法辦理。

六、最後完成裝訂稿的學位論文也需完成原創性比對，相關規定同第五條辦理。

七、修業年限之相關規定：修業年限最少三年，最多七年。

八、本要點如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。

九、本要點經所務會議通過後實施，修訂時亦同。

有關本校博士學位考試辦法中第五條博士學位考試委員，應對博士學位候選人之研究領域有專門研究，並具有下列資格之一：

- 一、現任或曾任教授、副教授。
- 二、中央研究院院士、現任或曾任中央研究院研究員、副研究員。
- 三、獲有博士學位，且在學術上著有成就者。
- 四、研究領域屬於稀少性或特殊性學科，且在學術或專業上著有成就。
 1. 前項第三、四款之考試委員認定資格，由辦理學位授予之各系、所、院務會議或學位學程會議定之。
 2. 系所訂定資格比較請參照以下。

經 1110503110 學年度第 2 學期第 2 次課程暨所務會議通過

本所遴聘研究人員或專業技術人員擔任學位考試委員之資格認定基準如下，須檢附

相關佐證資料，並經本系「所務會議」審查通過：

- (一) 須具有博士學位：檢附博士畢業證書影本。
- (二) 與博士班研究生所提論文研究領域具有相關專門研究（例：期刊發表或發明專利）或實務經驗（例：任職國內外知名公民營機構或研究單位達三年以上，並有執行重大研究或產學計畫之經驗），上述條件需檢附 Web of Science / EI(Engineering·Village 、 Inspec)查詢結果、發明專利證書、服務證明、計畫核定清單或產學合作合約書等。